

**Bremen, September 2008**

## **MESSEVORBERICHTERSTATTUNG ZUR ELECTRONICA 2008**

### **Neue Leistungsmerkmale bei Testeinrichtungen von Schneider & Koch**

Die Prüftechnik Schneider & Koch GmbH bietet dem Fachpublikum auf der diesjährigen Electronica wieder interessante Neuigkeiten aus den Bereichen optische (AOI) und elektronische Testeinrichtungen (ATE). Die bewährten Produkte LaserVision und LVCompact präsentieren sich mit deutlich verbesserten Leistungsmerkmalen - beispielsweise durch Farbkameras mit telezentrischen Objektiven und vergrößerten Arbeitsbereichen. Geringe Pseudofehlerraten, außerordentliche Bedienerfreundlichkeit und hohe Wirtschaftlichkeit zeichnen diese Testsysteme aus.

Weitere Schwerpunkte des diesjährigen Messeauftritts bilden eine Reihe von ICT-, Funktions- und Kombinationstestern auf Basis der neuen Ti<sup>2</sup>CA<sup>®</sup>-Line-Plattform. Durch die offene, modulare Hard- und Softwarestruktur der Systeme in den Versionen Ti<sup>2</sup>CA<sup>®</sup>-Base, -Light und -Premium lassen sich alle Systemkomponenten individuell kombinieren - erstmals auch im neuen, schwenkbaren Gehäuse, das für mehr Ergonomie am Testarbeitsplatz sorgt.

Zusätzlich präsentiert Schneider & Koch im Bereich Software die Weiterentwicklung der CAD-Converter ATE-CAD und LV-CAD. Im ATE Bereich wurde dabei die Anbindung an den ATE-Ti<sup>2</sup>CA-MDA überarbeitet. Im AOI Bereich beschleunigen und vereinfachen neue Features zum schnelleren Auffinden und Anspringen von Fehlern in CAD-Daten die Erstellung von Prüfprogrammen aus CAD-Daten erheblich.

Prüftechnik Schneider & Koch finden Sie in der **Halle A1 am Stand 621**.

Weitere interessante Neuigkeiten finden Sie ausführlich auch in unserem aktuellen Newsletter 2/2008, der zur Electronica erscheint, oder unter [www.prueftechnik-sk.de](http://www.prueftechnik-sk.de).